

ぜひお問い合わせ下さい。
次のような実績でもお役に立てます。

- 狭ピッチ / 高出力電源用ICの検査
- 低ON抵抗FETを出力段に持つ狭ピッチICの検査
- 狭ピッチのWLCSP・CSPの検査
- 2000〜4000接点数のコネクタ・ICソケットの実用化
- 1mm、2.54mm低背タイプのコネクタ・ICソケット
- >10GHz光電変換モジュールコネクタ

ケルビン^{接続} WLCSPテストソケットでも
ごくふつうに実践しています。

1,000,000サイクル 負荷耐久性能
0.4mm (0.32mm) バンプピッチマトリックス
1.5A/Probe 電流負荷対応



株式会社 **イス・イー・アール**

〒140-0001 東京都品川区北品川1-14-8 スタービル Tel: 03-5796-0330 Fax: 03-5796-3210
 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 新大阪グランドビル Tel: 06-6398-6008 Fax: 06-6398-6009
 E-Mail: ser@ser.co.jp Web Site: <http://www.ser.co.jp>